

1. Record Nr.	UNINA9910709507003321
Autore	Buehler Martin G
Titolo	Microelectronic test patterns / / Martin G. Buehler
Pubbl/distr/stampa	Gaithersburg, MD : , : U.S. Dept. of Commerce, National Institute of Standards and Technology, , 1974
Descrizione fisica	1 online resource
Collana	NBS special publication ; ; 400-6
Altri autori (Persone)	BuehlerMartin G
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia
Note generali	1974. Contributed record: Metadata reviewed, not verified. Some fields updated by batch processes. Title from PDF title page.
Nota di bibliografia	Includes bibliographical references.